

# DUAL VIEW ICP-OES OHNE ZEITVERSCHWENDUNG

The Measure of Confidence

Agilent 5100 ICP-OES



## Das schnellste ICP-OES aller Zeiten.

Das Agilent 5100 mit Synchronem Vertikalem Dual View (SVDV) ist die Revolution in der ICP-OES. Mit der einzigartigen DSC-Technologie (Dichroic Spectral Combiner) können Sie jetzt Messungen mit axialer und radialer Beobachtung gleichzeitig durchführen.

### Sparen Sie Zeit und Geld

- Die schnellste Analytik in der ICP-OES und damit weniger Argonverbrauch.
- Messung aller Wellenlängen in einem Messvorgang ermöglicht höhere Präzision ohne Verzögerungen.
- Starten Sie Ihre Messungen schneller: der Vista Chip II-Detektor benötigt absolut kein Spülgas und bietet kürzere Aufwärmzeiten.

### Kompromisslose Leistung

- Mit der stehenden (vertikalen) Fackel lassen sich auch die schwierigsten Proben ganz einfach messen.
- Der Halbleitergenerator gewährleistet eine ausgezeichnete Langzeitstabilität.

### Vereinfachter Arbeitsablauf

- Ersparen Sie sich das Rätselraten bei der Methodenentwicklung mithilfe der intuitiven ICP Expert-Software und der DSC-Technologie.
- Leistungsstarke Softwarealgorithmen vereinfachen die Methodenentwicklung, verbessern die Richtigkeit und erweitern den Arbeitsbereich.

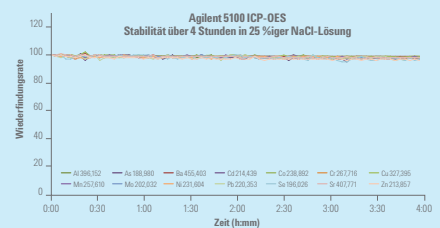
### Flexible Konfigurationen

Das Agilent 5100 ist in drei Konfigurationen erhältlich:

- Synchrones Vertikales Dual View.
- Vertikales Dual View.
- Radial View.

## ROBUST UND STABIL

Mit der stehenden (vertikalen) Fackel und dem robusten Halbleitergenerator in jeder Konfiguration ist das 5100 ICP-OES auch für die anspruchsvollsten Proben perfekt geeignet.



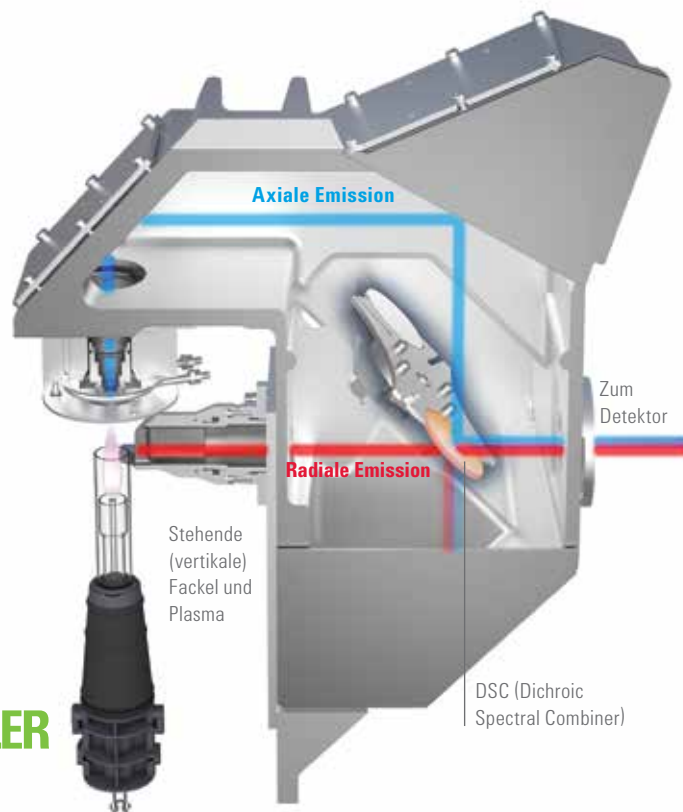
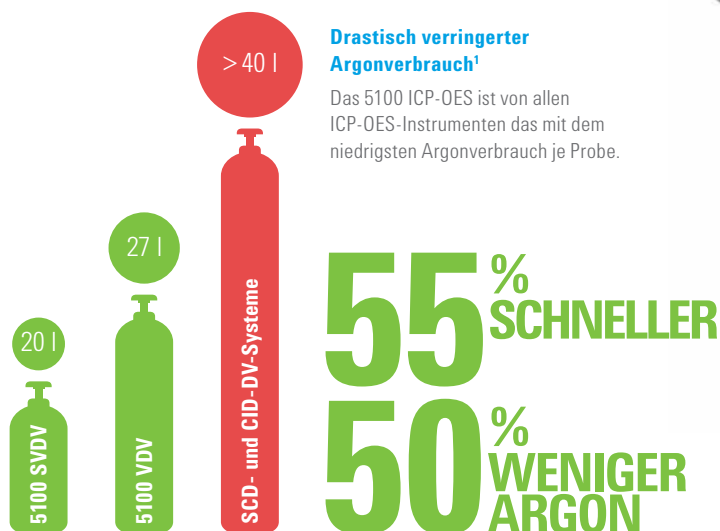
Gezeigt ist die Wiederfindungsrate einer Reihe von Elementen in 25 %iger NaCl-Lösung. Die Langzeitstabilität für alle Elemente lag über 4 Stunden bei < 1,3 % RSD - und das ohne Internen Standard!



Agilent Technologies

## Wie arbeitet ein Synchrones Vertikales Dual View?

Mit dem 5100 SVDV ICP-OES müssen Sie nur eine Messung je Probe durchführen. Die einzigartige DSC-Technologie (Dichroic Spectral Combiner) ermöglicht es, sowohl die axiale als auch die radiale Emission in einer einzigen Messung zu erfassen. So erhalten Sie richtige und präzise Ergebnisse in kürzester Zeit<sup>1</sup>.



### WUSSTEN SIE SCHON?

Bei konventionellen Dual View ICP-OES-Systemen müssen Sie eine Serie aufeinander folgender Messungen ausführen und vorher auswählen, welche Elemente im axialen und welche im radialen Modus gemessen werden sollen.

Manche Systeme sind außerdem für die Messung niedriger und hoher Wellenlängen in beiden Modi mit zwei Spalten ausgestattet. Für jede Probe sind daher bis zu vier aufeinander folgende Messungen erforderlich, was den Probendurchsatz entsprechend verringert.

1. Analysegeschwindigkeit und Argonverbrauch werden mit den Angaben für Systeme der Wettbewerber anhand der Daten aus publizierten Applikationschriften verglichen. Siehe Agilent Application Note 5991-4821EN

Weitere Informationen:  
Wenden Sie sich an Ihren Agilent Servicepartner oder besuchen Sie:  
[www.agilent.com/chem/5100icpoes](http://www.agilent.com/chem/5100icpoes)

Änderungen vorbehalten.

© Agilent Technologies, Inc. 2014  
Veröffentlicht am 1. Juli 2014  
5991-4835DEE

